



ДИСПЕРСИОННЫЙ ИК-СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

SPECTRION IR

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ:

- Контроль качества оптических свойств германиевых и кремниевых пластин
- Исследование отражения и пропускания золоченых зеркал и отражателей
- Определение коэффициента отражения низкоэмиссионного стекла

Дисперсионный ИК-спектрометр SPECTRION IR

Исследование свойств оптических материалов в ИК-области – это довольно важная и интересная задача, требующая высокоточного и уникального решения – дисперсионного ИК-спектрометра. Широко известные ключевые преимущества ИК-Фурье спектроскопии – скорость измерений, высокая разрешающая способность, низкий уровень шумов – идеально подходят для анализа фармацевтических субстанций, полимеров, химикатов, моторных масел, топлива и газов, но к сожалению, при анализе свойств оптических материалов, мы можем столкнуться с целым рядом проблем.

При использовании ИК-Фурье спектрометров образцы с оптическим покрытием, например, германиевые пластины, отражают излучение от пары подвижных зеркал интерферометра и возвращают их назад, а коническая форма луча из интерферометра также подвергается искажению. Сравнение результатов измерения пропускания узкополосного светофильтра на ИК-Фурье и дисперсионном ИК-спектрометрах приведено на Рис 1.

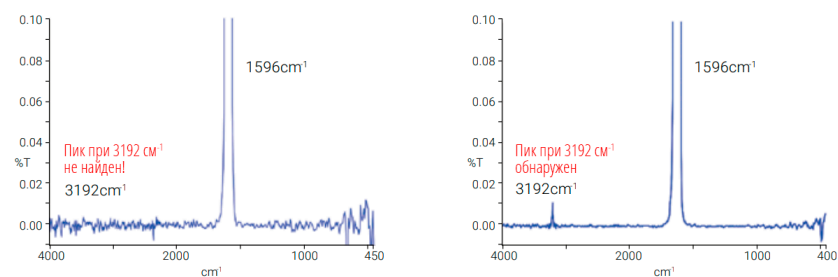


Рис. 1: ИК-спектры узкополосного фильтра, полученные на ИК-Фурье спектрометре (слева) и дисперсионном ИК-спектрометре (справа)

Компания «Шелтек» предлагает специализированный дисперсионный ИК-спектрометр SPECTRION IR, предназначенный для оптических измерений.

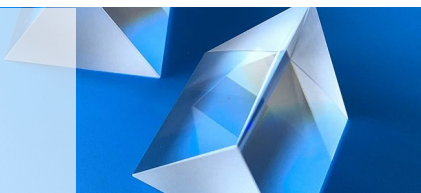
Ключевые особенности дисперсионного ИК-спектрометра SPECTRION IR:

- Истинно-двулучевая оптическая схема
- Поддержка приставки зеркального отражения (угол 30/45 град.)
- Удобное программное обеспечение

ООО "Шелтек"

Москва, Ленинский проспект, 38А
+7 (495) 935 8888 | 8 (800) 350 1336

шелтек.рус
info@scheltec.ru
www.scheltec.ru



Технические характеристики

Оптическая схема	Истинно-двулучевая
Детектор	DTGS
Диапазон волновых чисел, см ⁻¹	4000-400
Разрешение, см ⁻¹	1.5 около точки 1000 см ⁻¹
Точность установки волнового числа, см ⁻¹	4 (в области 4000-2000 см ⁻¹) 2 (в области 2000-400 см ⁻¹)
Воспроизводимость установки волнового числа, см ⁻¹	2 (в области 4000-2000 см ⁻¹) 1 (в области 2000-400 см ⁻¹)
Фотометрическая точность, %T	0.2 (без учета уровня шума)
Уровень рассеянного света, %T	0.5 (в области 4000-650 см ⁻¹) 1 (в области 650-400 см ⁻¹)
Кривизна базовой линии, %T	Не более 2
Интерфейс подключения к ПК	USB
Поддержка приставок зеркального отражения	Да, с углом 30, либо 45 град.
Электропитание	240 В, 2000 Вт
Габаритные размеры, мм	740 x 610 x 250

Решения для комплексного анализа оптических материалов и покрытий

Компания «Шелтек» предлагает самую полную линейку оборудования ION Engineering для комплексного исследования свойств оптических материалов



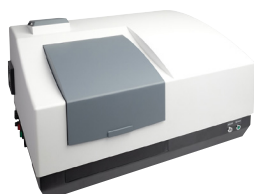
УФ/ВИД/БЛИК-СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ SPECTRION UV-NIR 2D И 3D

- Широкий диапазон длин волн: до 190-3600 нм в режиме пропускания
- Поддержка приставок диффузного отражения (интегрирующие сферы диаметром 100, 150 и 270 мм)
- Поддержка приставок зеркального отражения



ДИЛАТОМЕТРЫ INSPIRION DLH/DLV

- Определение коэффициента термического расширения кварца, стекла и кремния в широких диапазонах температур
- Возможность высокотемпературных измерений (до +1700 град. С)
- Возможность низкотемпературных измерений (до -150 град. С)



СПЕКТРОФЛУОРИМЕТР SPECTRION FL ULTRA

- Широкий диапазон возбуждения и эмиссии (от 200 до 900 нм)
- Большое число оптических щелей для повышения точности измерений
- Измерение абсолютного квантового выхода методом Ди Мелло



ИСП-МС СПЕКТРОМЕТР PLASMA MS 300

- Определение точного элементного состава кварца, стекла, германия, кремния и прочих чистых и композитных материалов
- Поддержка различных систем ввода пробы: чистых, Пельтье-охлаждаемых, HF-стойких